シリコン基板上の低損失ミリ波帯受動素子

平1 広 島 大 学 天 川 哉 ³ 東京工業大学 岡 -²・石 昇³・益 田 原 電子デバイス研究所 ₩,6 F 介⁴・畠 山英 樹⁵・相 沢 卓 道 脽

Low-loss Millimeter-wave Passives on Si

S. Amakawa, K. Okada, N. Ishihara, K. Masu, Y. Uemichi, H. Hatakeyama, and T. Aizawa

ミリ波帯を利用した数 Gbps を越える高速大容量無線通信が可能になりつつある今日, ミリ波帯で動作 する無線通信機器向けの低損失配線板が重要性を増している.当社では, ミリ波配線板に搭載するための 受動素子として,シリコン上銅配線技術によりミリ波伝送線路とバンドパスフィルタを設計・試作した結 果,それぞれ減衰定数 0.2 dB/mm という低損失と,1 dB 帯域幅 7.0 %,挿入損失 4.67 dB という高性能を 実現した.

Low-loss wiring board operating at millimeter-wave band is becoming more and more important these days because high-speed and large-data communications exceeding a few Gbps are being made available by utilizing millimeter-wave band. We designed and fabricated millimeter-wave transmission line and band-pass filter as passive components to be integrated on a millimeter-wave wiring board by using a copper wiring technology on silicon, and achieved low attenuation constant α of 0.2dB/mm in the transmission line and a low insertion loss of 4.67dB with 1-dB FBW of 7.0% in the band-pass filter.

1. まえがき

ミリ波帯を利用した数 Gbps の高速大容量通信が提 案,一部実現されつつある今日,60GHz帯で動作する 無線通信機器はより重要性を増している. 国内では 59GHz~66GHzという7GHzにもわたる広い周波数 帯域が特定小電力で利用可能であり、民生分野への普 及が期待されている.しかしながら化合物半導体や気 密封止パッケージ等といった部品から構成される従来 のミリ波通信機器は高価であるため、民生への普及に はこれに取って代わる CMOS-LSI を応用した低コスト 機器の実現が不可欠である. CMOS-LSI は大量生産性, 低コストという長所を持つ一方,CMOS プロセスで伝 送線路¹⁾, バラン²⁾, フィルタ^{3) 4) 5)</sub>等といった低損} 失な受動素子を実現することは配線密度を規定する厳 密なデザインルール、利用可能な誘電体の厚さが薄い ことに起因し、非常に困難である. そこで当社では、 厚膜誘電体と銅配線、完全なグラウンド層が利用可能 なシリコン上銅配線技術を応用することで低損失、小



図1 提案するミリ波モジュール概念図 Fig. 1. Sketch of the proposed millimeter-wave module.

型な受動素子を集積したミリ波配線板と,この配線板 にCMOS-LSIを実装したミリ波モジュールを提案して いる.この概念図を図1に示す.今回その初期検討と して,伝送線路及びバンドパスフィルタを設計・試作・ 評価したので結果を報告する.

2. マイクロストリップ伝送線路

ミリ波帯では、マイクロストリップライン等の伝送 線路で信号配線を形成する必要がある. CMOS-LSI に

¹ 先端物質科学研究科 半導体集積科学専攻

² 大学院 理工学研究科 電子物理工学専攻

³ 統合研究院 ソリューション研究機構

⁴ シリコン技術開発部

⁵ シリコン技術開発部 主査

⁶ シリコン技術開発部 グループ長



図2 マイクロストリップ伝送線路の断面図 Fig. 2. Cross-sectional sketch of the micro-strip transmission line.



図3 マイクロストリップ伝送線路の写真 Fig. 3. Micrograph of the micro-strip transmission line.





おいて特性インピーダンス 50 Ωで伝送線路を設計し た場合,配線幅が細くなるために導体損が大きくなる. これは CMOS 技術で利用できる誘電体の厚さが薄い ことに起因する.また,配線密度ルールにより下地の シリコン基板を完全に遮蔽するようなグラウンド層を 実現することができず,渦電流損による損失が大きく なるという問題がある.これらの問題から,CMOS-LSI における伝送損失は約 2dB/mm にも達する¹⁾.ミ リ波帯における電力合成・分配器等といった受動素子 は、4分の1波長(λ/4)を単位長さとして、そのN 倍程度の長さの配線で構成される場合が多く、前記の 伝送損失と配線長で決まる受動素子の損失は大きなも のとなる.たとえば、4分の1波長の長さ(約0.7 mm)を有する伝送線路の損失は、約1.4 dBに達する. また、CMOS-LSIのなかでも微細プロセスは面積あた りの単価が高額なため、受動素子の集積化は高コスト 化に繋がる.これらCMOS 技術の短所を解決、補完 するため我々は図1に示すようなシリコン上銅配線技 術を応用し、低損失な各種受動素子(伝送線路、アン テナ,カプラ,バラン,フィルタ)を集積した配線板 に CMOS-LSI チップをフェースダウン実装したミリ波 通信モジュールを提案しており、この初期検討として、 伝送線路を設計・試作した. 伝送線路を設計する前に 別途1波長リング共振器を製作し,透過係数が極大に なる周波数からミリ波帯における誘電体の実効比誘電 率を 2.6. 共振器の Q 値から減衰定数を 0.2 dB/mm と 見積もった、その後得られた物性値からマイクロスト リップ構造の伝送線路を設計した. 図2はその断面図 である.本技術では、液状樹脂の回転塗布と硬化によ り誘電体を形成するので、20 μm 程度の比較的厚い誘 電体層が形成可能である。特性インピーダンス 50 Ω の場合は、45 µmの配線幅が確保可能である.なお、 配線板にアンテナを集積する場合には特性上の観点か らガラス基板が望ましいが、今回は実験の容易性から シリコン基板を用いている. 今回試作したマイクロス トリップ伝送線路では両者の差異は現れない.図3は 試作したマイクロストリップ伝送線路の写真である. 散乱行列の測定は2 port ネットワークアナライザ (Agilent E8361A) を用いて行った. 伝送線路本来の 特性を抽出するためには、測定パッドに起因する寄生 容量等の並列寄生成分や接触抵抗、寄生インダクタン ス等の直列寄生成分を除去しなければならない. ミリ 波帯においてこれら寄生成分の影響は直列インダクタ のリアクタンスがωL, 直列キャパシタのリアクタンス が1/ωCと表現できることに起因し、マイクロ波帯と 比較して特に顕著になる. 我々は寄生成分の除去 (Deembedding)を,長さの異なる2本の伝送線路を測定し, 各々の散乱行列を演算処理することで実現した.結果 として2本の伝送線路長さの差分長を持つ伝送線路本 来の伝送特性(ABCD 行列)が抽出可能となる.次に、 得られた伝送特性から伝播定数を算出した. 算出した 減衰定数は 60 GHz において 0.2 dB/mm, 位相定数は 2019 rad/m であった. これらの結果は先に述べたリ ング共振器の解析結果ともよく一致する.図4は抽出 した特性インピーダンスの実部と周波数の関係であ る. ミリ波帯においても設計値 50 Ωが精度よく実現 できていることがわかる.このことは前述した誘電体 のミリ波帯における物性抽出が正しく行われたことを 意味する.



図5 バンドパスフィルタの写真 Fig. 5. Micrograph of the band-pass filter.

3. バンドパスフィルタ

バンドパスフィルタは、送信機において帯域外信号 を除去するためのデバイスである.ここでは、平行2 線路結合共振器から構成される、3次のチェビシェフ バンドパスフィルタを設計・試作した. 目標規格とし て、帯域内リップル、比帯域幅、中心周波数をそれぞ れ 0.1 dB, 10 %, 60 GHz に設定した. この後, 設計仕 様に対応したgパラメータを用いてアドミッタンスイ ンバーターを計算し、誘電体厚さを 20 µm と仮定して レイアウト設計をおこなった. 共振器の長さは 800 µm である.3次のチェビシェフバンドパスフィル タの場合,2種類の平行2線路結合共振器から構成さ れるが, それらの線路幅 / 線間幅は 32.5 μm / 7.5 μm, 45 µm / 25 µm となる. 製作したバンドパスフィルタ の写真を図5に示す.フィルタ部の大きさは3.3 mm × 0.3 mm である. これらの実際に試作したフィルタ の寸法条件を設定した後,電磁界解析を実施した.電 磁界解析は Sonnet EM Suites を用い, 測定は 67 GHz のネットワークアナライザ (Agilent E8361A) を用い た.図6は散乱行列の測定結果と電磁界解析結果を比 較したものであるが、測定結果と解析結果はミリ波帯 においても非常に良い一致を示すことが分かった. 56.7 GHz における挿入損失は測定結果が 4.67 dB, 解析 結果が 5.05 dB となり, 0.4 dB 以内で一致した. この ことから, 電磁界解析の結果がミリ波受動素子の設計 にも十分信頼し得るものであることを確認した. 1 dB 帯域幅は7.0%であり、今回製作したフィルタの特性 がこれまでに報告された CMOS 技術で実現された特 性^{3) 4) 5)} に比べ十分に良いことを示している. 今回試 作したフィルタは、設計と比べて誘電体厚さが約20 %小さくなっているが、仮にこれらが設計どおりに実 現できれば特性はさらに改善(挿入損失 3.66 dB, 1 dB帯域幅 9.2%) する見込みである.参考として、図 7に製作した誘電体厚さ16 µmのフィルタの挿入損の 測定値と解析値,設計値の誘電体厚さ20 µmの解析値, 誘電体厚さ24 μmの解析値の比較を示す. 文献⁶⁾記 載のフィルタの挿入損,帯域,共振器Q値の関係式(1) が示す通り、帯域幅が広いほど低挿入損失となり、誘



図6 バンドパスフィルタの通過,反射特性(実測結果, 解析結果の比較)

Fig. 6. Transmission and reflection characteristics of the band-pass filter - measurement and simulation.



図7 バンドパスフィルタの挿入損失と誘電体厚さの関係 Fig. 7. Relationship between insertion loss and dielectric thickness of the band-pass filter.

電体厚さ24 μmの場合,帯域内の最小挿入損は2.89 dB,1 dB帯域幅は11.6%と見積もられる.

4. む す び

シリコン上銅配線の技術を応用したミリ波帯受動素 子集積配線板に CMOS-LSI をフェースダウン実装した ミリ波モジュールの初期検討として、マイクロスト リップ伝送線路とバンドパスフィルタを設計・試作し た.マイクロストリップ伝送線路は60 GHz帯におい て減衰定数0.2 dB/mmという低損失な伝送特性を実 現し、バンドパスフィルタは1 dB帯域幅11.6%で挿 入損失 2.89 dB という, CMOS 技術と比べ格段に高い 性能を実現し得ることを確認した.

参考文献

- I.C.H. Lai, M.Fujishima : "High-Q Slow-Wave Transmission Line for Chip Area Reduction on Advanced CMOS Processes," IEEE ICMTS, Mar. 2007, pp.192-195, 2007
- J.-X.Liu, C.-Y.Hsu, H.-R.Chuang, C.-Y. Chen : "A 60 GHz Millimeter-wave CMOS Marchand Balun," IEEE RFIC-S, pp.445-448, 2007
- J.Brinkhoff, F. Lin : "Integrated Filters for 60 GHz Systems on CMOS," RFIT, pp.154-157, 2007,

Singapore

- 4) S.Sun, J. Shi, L.Zhu, S.C.Rustagi, K.Mouthaan : "Millimeter-Wave Bandpass Filters by Standard 0.18-μm CMOS Technology," IEEE Electron Device Lett., Vol.28, No.3, pp.220-222, 2007
- L.Nan, K.Mouthaan, Y.-Z. Xiong, J.Shi, S.C.Rustagi, B.-L. Ooi: "Design of 60- and 77-GHz Narrow-Bandpass Filters in CMOS Technology," IEEE Trans. Circuits and Systems, Vol.55, No.8, pp.738-742, 2008
- S.B.Cohn: "Dissipating Loss in Multiple-Coupled-Resonator Filters," Proceeding of the IRE, Vol.47, pp.1342-1348, 1959